#### Лабораторна робота № 4

### ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ЛУЖНО-ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛАХ

#### Мета роботи:

1. Дослідити оптичні властивості центрів забарвлення в іонних кристалах.

2. Познайомитися з принципом дії Shumadzu UV-1800 та методами роботи на ньому.

#### Обладнання:

спектрофотометр Shumadzu UV-1800, опромінені кристали KCl, NaCl, KBr, LiF. Загальні відомості.

Чисті кристали галогенидів лужних металів прозорі у видимій області спектра. Однак, якщо чистий лужно-галоїдний кристал нагрівати в парі одного з складових його елементів (металу: Na, K, Li,...) або опромінювати рентгенівськими променями спостерігається фарбування, видиме неозброєним оком. Якщо кристал хлористого натрію нагрівати в присутності парів натрію, то він набуде жовтого кольору; хлористий калій, нагріти в парах калію - стає фіолетовим, KBr - блакитний. Викликати забарвлення можна також опроміненням  $\gamma$  - променями або нейтронами.

Центр забарвлення – дефект кристалічної гратки, який поглинає світло. Найпростішим видом центрів забарвлення є так звані F-центри. Назва «F центр» походить від німецького слова «farbe»- фарба.

При ретельному вивченні спектрів поглинання забарвлених кристалів вдалося виявити широку полосу поглинання так звану F-полосу. F-центр, складається з аніонної вакансії, яка, діючи як ефективний позитивний заряд, утримує при собі вільний електрон, що поставляється, наприклад, надмірним атомом лужного металу в результаті його іонізації, ж введеним в гратку домішковим атомом (рис. 1). Також електрон може стати вільним при поглинанні зовнішнього електромагнітного опромінення.



Рис.1. Схематичне зображення F-центру у NaCl.

Таке припущення про F- центри підтверджується цілим рядом фактів :

1. Полоса поглинання, обумовлена наявністю «F- центрів», не залежить від того, яким способом проведено забарвлення кристалу, нагріванням в парі металу або опромінюванням.

2. Забарвлені кристали мають меншу пікнометричну густину, ніж незабарвлені.

3. Кристали, що містять F -центри можуть знебарвлюватися під дією світла, довжина хвилі якого відповідає максимуму F-полоси. Тобто у всіх кристалах F-центри мають одну і ту ж природу.

Окрім «F - центрів» кристали можуть мати багато інших центрів забарвлення. Наприклад, вакантна позиція додатньозарядженого іону притягує до себе дірку електрона та утворює «V- центр».

Для вивчення природи центрів забарвлення велике значення має дослідження процесу їх термічного відпалу. В результаті відпалу також відбувається знебарвлення кристалу.

Дослідження спектрів поглинання забарвлених кристалів проводиться за допомогою спектрофотометра Shumadzu UV -1800.

Спектрофотометра Shumadzu UV-1800

Спектрофотометр Shumadzu UV-1800 дозволяє працювати в наступних режимах:

- спектральний сканування по довжині хвилі з можливістю подальшої обробки спектра (визначення положення максимумів і мінімумів, арифметичні операції, розрахунок площі, згладжування);
- фотометричний вимірювання оптичної густини або пропускання на одній або декількох (до 8) обраних довжинах хвиль;
- кінетичний реєстрація зміни поглинання, пропускання або енергії в часі.



Рис. 2. Зовнішній вигляд спектрофотометру Shumadzu UV-1800.

Управління приладом можливо двома способами:

1) з використанням пульта управління (рис.2.);

2) з використанням комп'ютера.

У більшості випадків управління з використанням комп'ютера краще, тому цей спосіб і буде використовуватися в роботі.

Порядок роботи на спектрофотометрі Shumadzu UV -1800:

1. Увімкніть комп'ютер. Дочекайтеся завантаження операційної системи. Візуально перевірте наявність підключення приладу до комп'ютера кабелем USB.

2. Увімкніть прилад (справа внизу, рис.2.). Зачекайте ~2 хв поки пройде автоматична перевірка стану. Усі 10 параметрів повинні мати статус «ОК ». У відповідь на запит пароля натисніть на пульті управління «Enter». Виберіть

управління з комп'ютера «PC Ctrl» (клавіша F4). Далі управління приладом здійснюється з комп'ютера за допомогою програми UVProbe (на пульті управління більше нічого не натискайте).

3. Запустіть програму UVProbe (рис. 3). Побудову спектральної кривої проходження виконує спектральний модуль програми.

4. Виберіть Window > Spectrum.

5. Натисніть на панелі керування клавішу Connect для з'єднання з приладом .

6. Підготовка до сканування спектру. Для того щоб прирівняти фон до нуля у всьому обраному діапазоні довжин хвиль необхідно виконати корекцію базової лінії. Перед початком корекції переконайтесь, що зразок невстановлений.

a) Натисніть на панелі керування приладом кнопку Baseline, щоб ініціювати операцію корекції.

б) Після появи діалогового вікна Параметри базової лінії введіть 800 і 300 це початок і кінець діапазону довжин хвиль.

Увага! Стартова довжина хвилі (Початок) повинна бути більше кінцевої!

в) Натисніть ОК. При процедурі корекції базової лінії змінюються показання у вікні «Статус приладу».



Рис.3. Запуск програми UVProbe.

| -Манель спектра                    |                             | — Метод      |           | Сшивка |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|
| — Пан                              | — Панель операций           |              | ь данных  |        |
|                                    | _ Панель метода             |              | Обработка |        |
|                                    | 4 🗄 🗞 🖻                     | M 🗄 👬        | 11 🚣 🖊    | 13     |
| Свойства с                         | файла                       | Таблица пи   | ков       |        |
|                                    | Настройка 🔟                 | Выбо         | р точек 🔟 |        |
|                                    | 1лощадь пика  —             | ]            |           |        |
| ис.4. Панель інстру                | ментів                      |              |           |        |
| pectrum Method                     |                             | ? X          |           |        |
| Measurement Sample Preparation Ins | trument Parameters Attachme | mte          |           |        |
| Wavelength Range (nm): Start: 80   | 10 to End: 300              |              |           |        |
| Scan Speed:                        | edium 💌                     |              |           |        |
| Sampling Interval (nm):            | 5 🔽 Auto Sampling           | g Interval 🔽 |           |        |
| Scan Mode<br>Single C              | Auto C                      | Repeat       |           |        |
| Repetitions: 2                     | Time Interval:              | Seconds      |           |        |
| Filename: C:\Program Files\        | Shimadzu\UVProbe\File_1004  | 13 >>        |           |        |
| Auto Print Report:                 |                             |              |           |        |
| Report File Name:                  |                             |              |           |        |
|                                    | OK                          | Отмена       |           |        |

Рис. 5. Діалогове вікно «Спектральний метод».

7. Помістіть зразок у кюветноє відділення приладу.

а) для вибору методу сканування виберіть Edit> Method або натисніть на значок Метод, з'явиться діалогове вікно «Спектральний метод» (рис. 5).

б) Введіть 800 в Start і 300 в End.

Р

Увага! Стартова довжина хвилі повинна бути більше кінцевої!

в) Виберіть швидкість сканування (Scan speed) - "Medium".

г) Виберіть автоматичний інтервал виміру (Auto sampling interval).

д) Виберіть одноразове сканування (Scan mode - Single).

е) Натисніть вкладку Параметри приладу (Instrument Parameters) - з'явиться наступне діалогове вікно (рис.6.)

ж) Виберіть Проходження (Transmittance) у рядку Режим вимірювання (Measuring Mode).

Всі інші установки методу залиште за замовчуванням.

з) Натисніть ОК для установки параметрів приладу.

8. Виконання сканування спектру.

а) Натисніть Start на панелі керування приладом.

б) Після завершення сканування натисніть на графічній панелі вкладку «Active».

| Spectrum Method  |                          |                 |           | <u>?</u> × |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Measurement Sam  | ple Preparation Instrume | ent Parameters  | achments  |            |
| Measuring Mode   |                          | Slit Width(nm): | 1.0 Fixed |            |
| Source Lamp:     | OFF                      | SiPD Gain:      | 0 (Min)   | <b>V</b>   |
| Light Source Cha | ange Wavelength (364-29  | 15 nm): 340.8   |           |            |
| S/R Exchange:    | Normal                   |                 |           |            |
|                  |                          |                 |           |            |
|                  |                          |                 |           |            |
|                  |                          |                 | ок        | Отмена     |

Рис. 6. Діалогове вікно параметри приладу (Instrument Parameters).

# 9. Пошук піків.

Виберіть Operations> Peak Pick.

10. Роздрукуйте результати.

Натисніть правою клавішею миші на панелі операцій. Виберіть «Print» (рис. 7) (на панелі операцій).

| No.       P/V       Wavelength nm.       T%       Description         1       6       487.50       99.310         2       6       441.50       100.145  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Image: Second system       Image: Second system <th< td=""></th<> |  |  |  |  |  |
| No.         P/V         Wavelength nm.         T%         Description         123.636           1         1         487.50         99.310         123.636         120.000           2         1         441.50         100.145         100.145         120.000  |  |  |  |  |  |
| No.         PA         Wavelength nm.         T%         Description           1  |  |  |  |  |  |
| 1           |  |  |  |  |  |
| 2 (1) 475.50 99.155 120.000<br>3 (1) 441.50 100.145   |  |  |  |  |  |
| 3 🙃 441.50 100.145  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 4 📀 509.00 99.147 Select All  |  |  |  |  |  |
| 5 0 478.00 99.106   |  |  |  |  |  |
| 6 🔕 467.00 98.857 🗸 Mark Peaks  |  |  |  |  |  |
| ✓ Mark Valleys  |  |  |  |  |  |
| ✓ Show Peaks  |  |  |  |  |  |
| Show Valleys 100,000  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| Measurement Properties  |  |  |  |  |  |
| Wavelength Range (nm.): 300.00 to 800.00  |  |  |  |  |  |
| Scan Speed: Medium  |  |  |  |  |  |
| Sampling Interval: U.S.   |  |  |  |  |  |
| Scen Mode: Sindle   |  |  |  |  |  |
| 80.000  |  |  |  |  |  |

#### Рис. 7.

Натисніть правою клавішею миші на графічній панелі «customire» та встановіть максимальну товщину лінії (рис. 8)

Для сканування інших зразків повторіть дії пунктів 7 - 10, встановлюючи по черзі зразки в кюветноє відділення.

Після закінчення роботи натисніть на панелі керування приладом «Disconnect». Після цього прилад можна вимкнути.

#### Порядок виконання роботи.

1. Добитися забарвлення кристалів KCl, NaCl, KBr, LiF, опромінюючи їх рентгенівськими променями. Час опромінення 4-7 годин.

2. Вивчивши залежність оптичної густини зразка від довжини хвилі, знайти полосу поглинання F-центрів і енергію основного рівня електрона.

| Кристал | λ, нм | E, eB | Забарвлення кристалу після опромінення рентгеном |  |  |
|---------|-------|-------|--|--|--|
| KCl     |       |       |  |  |  |
| NaCl    |       |       |  |  |  |
| KBr     |       |       |  |  |  |
| LiF     |       |       |  |  |  |

3. Дані занести в таблицю.

### Звіт

#### Звіт про виконану роботу повинен вміщувати:

1. Графік залежності коефіцієнта пропускання для всіх зразків, які містять «Fцентри», від довжини хвилі світла, яке проходить через ці зразки.

2. Заповнена таблиця.

# Контрольні питання.

1. Що таке F-центри?

2 Чому ми спостерігаємо різне забарвлення лужно-галоїдних кристалів після опромінення рентгеном?

3. Чому при відпалі F-центри руйнуються?

# Література.

- 1. Китттель Ч. Введение в физику твердого тела М. Наука 1978.
- 2. Мотт и Генри. «Электрические процессы в ионных кристаллах».
- 3. Описание прибора Shumadzu UV-1800.